

Especificaciones SPM MultiMode, Veeco Instruments, Inc.

Microscopio	Cabezal MultiMode SPM (Tapping, Contacto, STM)	
Ruido	$> 0.3 \text{ \AA}$ RMS en eje Z, con aislamiento de vibraciones	
Tamaño de muestra	$\leq 12 \text{ mm}$ en diámetro, $\leq 5 \text{ mm}$ en espesor	
Porta sondas/puntas	Modo tapping/modo contacto en aire	
	Modo tapping/ fuerza eléctrica/fuerza magnética	
	Modulación de fuerza en aire	
	Convertidor STM	
Aislamiento de vibraciones	Campana de aislamiento termo-acústica	
	Mesa de aislamiento de vibración mecánica integrada ($> 1 \text{ Hz}$)	
Opciones de Hardware/Software		
Sistema de visión óptico	Proporciona vista vertical de la sonda y la superficie de la muestra con un microscopio óptico y una cámara CCD a color	
Controlador	NanoScope versión IVa	
Modulo electrónico Cuadrex	Proporciona el hardware para la detección de frecuencia y fase para el Mapeo de fase, MFM, EFM	
Opción de nano-indentación y scratching	Proporciona software, porta-sonda y punta de diamante para experimentos de nano-indentación y scratching	
Módulo de aplicación	CAFM; proporciona software, porta-sondas y puntas para mediciones de AFM conductivo	
Escáner	Rango lateral (X-Y)	Rango vertical (Z)
AS-12NM	10 μm x 10 μm	2.5 μm

Técnicas de medición posibles

Microscopía de Fuerza Atómica modo Contacto
 Microscopía de fuerza Atómica modo Tapping
 Microscopía de Barrido Túnel (STM)
 Mapeo de Fase
 Modulación de Fuerza
 Microscopía de Fuerzas Eléctricas
 Microscopía de Fuerzas Magnéticas
 Microscopía de Fuerza Lateral
 Microscopía de Fuerza Atómica modo Conductivo (con Modulo de aplicación)
 Microscopía de Potencial de Superficie (Kelvin Probe Microscopy)
 Nanoindentación y scratching

Expandible a:

Microscopía capacitiva de Barrido (con módulo de aplicación)
 Microscopía Electroquímica de Barrido en modo AFM Y STM (con hardware adicional)
 Microscopía térmica de barrido (con módulo de aplicación)